

セイコープレシジョン株式会社

微小異物分析技術のご紹介

〇〇株式会社 御中

2008年2月1日

SEIKO
セイコープレシジョン株式会社
SEIKO PRECISION INC.

事例：携帯電話用カメラの微小異物分析

【概要】

携帯電話用カメラにおける画像不良は、その大部分が光学経路に付着した異物が原因です。この異物の組成を特定することにより、工程改善や不良低減を図ることが出来ます。

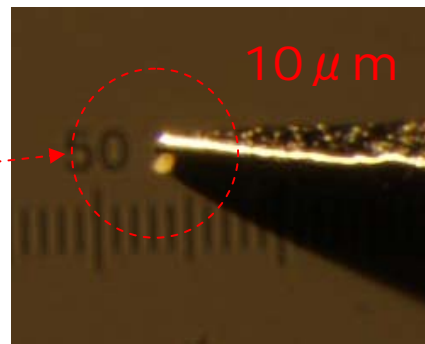
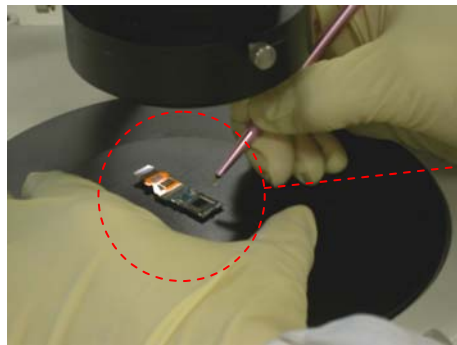
弊社では、2002年以降、5000万個以上の携帯電話用カメラの生産を通して、微小異物の分析技術、スキルを培ってきました。

5000検体以上のデータベースやノウハウを活かし、『異物による問題』解決のご提案を致します。

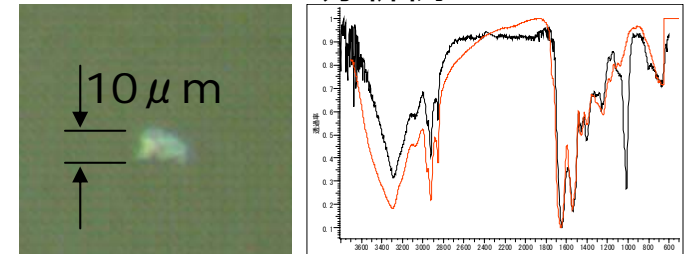
【所有設備】

- ・有機系異物分析 → FT-IR（透過、反射、ATR分析、アレイ素子による面分析に対応）
- ・無機・金属系異物分析 → SEM・EDX（低真空、高真空に対応。Be～U検出可能）
- ・FTIRデータベース → 約5500件（内、弊社独自データベース 500件）

マイクロサンプリング



FTIR分析例



EDX分析例

